



Instrumento de Controle de Qualidade

X-Rite Ci™52

Espectrofotômetro de Bancada

Um instrumento versátil para medição uniforme da cor de uma ampla variedade de amostras em diversos materiais, tamanhos, formas, texturas e níveis de opacidade. A medição simultânea da cor e da aparência melhora a exatidão. Um sistema compatível com o NetProfiler3 garante um desempenho constante e preciso.



Vantagens do X-Rite Color i52

Versátil. Trabalha tanto no modo portátil como em bancada; a tecla de leitura remota proporciona praticidade

Fácil de Operar. Funcionamento do tipo “fechar e acionar” auxiliado por indicadores de estado visual (LED) e sonoro

Melhor Integralidade das Medições. A base retrátil com a janela de alvo tem um sistema amortecedor de movimento e o acionador remoto das medições facilitam medir amostras difíceis de manusear.

Aceita uma Ampla Gama de Amostras e Dimensões. Capacidade de medição de amostras com 14 mm ou mais em materiais tais como papel, plástico, têxteis e uma variedade de superfícies duras

Leituras Rápidas e Exatas. Tempo de medição de 2 segundos em amostras planas padronizadas e também com formas complexas

Desempenho Confiável. Medição simultânea dos componentes especulares incluído (cor) e excluído (aparência) para determinar a influência respectiva

Medições Uniformes. Possui alta concordância interinstrumental capaz de garantir a uniformidade do controle das cores em vários instrumentos

Compatível com o NetProfiler®3. O sistema incorporado otimiza o desempenho do instrumento e permite a certificação remota

Transição perfeita. Funciona em concordância com os espectrofotômetros existentes X-Rite SP64, SP62 e SP60



Especificações do X-Rite Color i52

Geometria de Medição	d/8°, acionador espectral com Amostragem Rotacional Dinâmica (DRS)
abertura de medição:	Área de medição de 8 mm Janela de alvo de 14 mm
Fonte de Luz	Lâmpada de tungstênio com gás inerte
Receptor	Fotodiodos de silício aprimorados para o azul
Faixa Espectral	400 – 700 nm
Intervalo Espectral	Medição a cada 10 nm Resultados a cada 10 nm
Intervalo de medição	0% a 200% de reflectância
Tempo de Medição	Aproxim. 2 segundos
Concordância Interinstrumental	CIE L*a*b*: Média 0.30 ΔE*ab, com base na média de 12 cerâmicas BCRA Series II (componente especular incluído) 0.50 ΔE*ab máx. em uma cerâmica qualquer (componente especular incluído)
Repetibilidade a Curto Prazo	0.05 ΔE*ab sobre cerâmica branca
Compatível com NetProfiler® incorporado	
Vida Útil da Lâmpada	Aproxim. 500000 medições
Energia Elétrica	Especificações do Adaptador de CA 90 – 130 V AC ou 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, máx. de 15 W
Interface de Dados	USB
Faixa de Temperaturas de Operação	10° C a 40° C (50° F a 104° F) 85% de umidade relativa máxima (não condensante)
Faixa de Temperaturas de Armazenamento	-20° C a 50° C (-4° F a 122° F)
Peso	1.9 lb (0,87 kg)
Dimensões	Altura 10,9 cm (4.3”), Largura 9,1 cm (3.6”), Comprimento 21,3 cm (8.4”) (10,9 cm 8,4 cm 19,6 cm)
Acessórios Fornecidos	Padrões de calibração: coletor negro, padrão branco removível, manual de operação, adaptador de CA, cabo USB com sistema anti-tração
Opções	Suporte de bancada opcional Acessórios para apresentação de amostras

X-RITE WORLD HEADQUARTERS

Grand Rapids, Michigan USA • (800) 248-9748 • +1 616 803-2100 • xrite.com

©2011, X-Rite, Incorporated. All rights reserved. L10-447-PaintPT (05/11)

